

نظام قياس الصورة  
المجهرية السطحية

3D altisurf®  
500

- منصة القياس المعيارية 100 × 100 × 100
- اثنتين من تحقيقات : قياس مدى 1.1 ميكرون
- الإزاحة الدقيقة للمنصة =  $0.7 \mu\text{m} / 100\text{mm}$
- المواصفات النموذجية: 2 / nm سيغما /  $\text{nm}^3$ .
- سرعة الحركة والخطوات القابلة للتعديل
- كاميرا CCD عالية الوضوح لتحديد مناطق القياس
- الحد الأقصى لوزن العينات: 10



الإهتزازات

+ مولدين للطاقة



دينامومتر  
« KISTLER »

(KISTLER 9257 B) لقياس المكونات الثلاثة لقوة القطع.  
سلسلة القياس من:

جهاز كمبيوتر مع البرمجيات

خصائصه الرئيسية هي:

- صلابة عالية ، وتيرة طبيعية عالية جدا.
- مجموعة قياس واسعة.
- الخطية جيدة ، دون التباطؤ.
- استخدام بسيط (جهاز للاستخدام)
- مقاومة للزيوت حسب فئة حماية IP 67
- كبل خاص مع عزل عالي للوصلة بين المقياس ومضخم الإشارة ( 5 8 ) .



جهاز فوق الصوتية

جهاز لحساب سمك:  
نطاق السيطرة: دقيقة. 10-0 25-0 (القياس في

( يأتي مع مجموعة واحدة من بطاريات البلى  
U0001 مع جميع الملحقات ( U0002 U0003  
U0015.06 U0015.09 U0015.14 U0015.34  
U0015.37 U0016 U0017 U0018



:  
1  
20 5100 1  
STRAINSMART"





الموقع تحت الصيانة